سنتز و بررسی خواص نوری و مغناطیسی اثر آلاینده همزمان مرامیک ایران بر نانوذرات اکسید روی

شكوفه احمدپور \، ابراهیم شریفی ّ\*، محمدرضا نیلفروشان ّ

<sup>۱</sup>دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شهر کرد، ایران استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهر کرد، ایران <sup>۳</sup>دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهر کرد، ایران

چکیده: در این پژوهش به بررسی اثر آلایش همزمان یون کبالت به همراه یونهای منیزیم، کلسیم و مس با استفاده از روش سل- ژل بر روی خواص ماده پرداخته شد. خواص ساختاری، ریختشناسی و ایتیکی نانوذرات سنتز شده با استفاده از یراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)، طیفسنجی فروسرخ (FTIR) و طیفسنجی DRS مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل به روش ریتولد الگوهای XRD ساختارتک فاز ورتزیت هگزاگونال را تایید نمود. در طیف سنجی فروسرخ باندهای مربوط به این ساختار در عدد موج در حدود ۲۰۰ cm شناسایی شد. تصاویر میکروسکوپی نشان داد که ذرات ریز اکسید روی با ابعاد ۱۰ تا ۲۰ نانومتر در اثر چسبیدن به یکدیگر آگلومره شدهاند. علاوه بر این مشخص شد که شکاف باند نمونههای آلاییده شده نسبت به اکسید روی خالص کاهش یافته است. گاف انرژی در اثر افزوده شدن کبالت به عنوان آلاینده از ۳/۰ eV به ۲/۵ eV و با اضافه شدن مس به عنوان آلاینده دوم به ترکیب، سبب کاهش بیش تر و رسیدن به حدود ۲/۱ eV می شود. همچنین بررسی نمونه ها با دستگاه VSM نشان داد که خواص مغناطیسی ذرات با اضافه شدن آلاینده کبالت تقویت شده و به F· memu/g می رسد. اما در نتیجه هم آلاییده شدن خاصیت مغناطیسی به دلیل حضور یون غیرمغناطیسی کم میشود و تنها در نمونه حاوی هم آلاینده مس و کبالت تغییر محسوسی ایجاد نمی شود. لذا می توان این نمونه را مناسب ترین نمونه ساخته شده در کاربرد نیمه رسانای مغناطیسی رقیق به حساب آورد.

كلمات كليدى: نانو ذرات، اكسيد روى، سل - ژل، نيمهرسانا مغناطيسى رقيق شده.



نویسنده مسئول: دكتر ابراهيم شريفي گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهر کر د نوع مقاله: پژوهشی صفحههای: ۴۹ تا ۵۷ شاپا چاپی: ۳۳۵۱–۱۷۳۵ شاپا الکترونیکی: ۳۰۹۷–۲۷۸۳ زبان نشریه: فارسی دسترس پذیر در نشانی: www.JICERS.ir تاريخ دريافت: 14../1./78 تاريخ پذيرش: 16../14/.4

DOR: 20.1001.1.17353351.1400.17.0.10.9

مقدمه

امروزه ساخت نیمهرساناهای رقیق شده مغناطیسی (DMS) بر پایه نیمهرساناهای گروه II-VI در ابعاد نانومتری توجه زیادی را در مجامع علمي كسب كرده است [1]. از جمله اين نيمهرساناها مي توان به CdMnTe اشاره كرد كه در أن ظرفيت كاتيون با يون مغناطیسی Mn یکسان است. اما این مواد به دلیل سختی ساخت نوع n و p خیلی مورد توجه نیستند. پس از کشف نقش فرومغناطیس القایی حفره در مواد DMS بر پایه نیمهرساناهای III-V مثل GaMnAs مطالعات زیادی به سمت این مواد معطوف شد. اما مشکل این مواد هم عدم خاصیت فرومغناطیس در دمای اتاق بود. به همین دلیل تلاشها به سمتی رفت تا خاصیت فرومغناطیس را بتوان در دمای اتاق ایجاد کرد و توجهها معطوف به مواد DMS اکسیدی SnO<sub>2</sub> ،TiO<sub>2</sub> ،ZnO و In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> شد. برای ایجاد نیمهرساناهای رقیق شده مغناطیسی میتوان عناصر فلزات انتقالی همچون نیکل، کروم، کبالت، آهن و منگنز را به یک ماده نیمهرسانا همچون اکسیدروی اضافه نمود [۲]. در بین اکسیدهای فلزی اکسید روی (ZnO) به دلیل پایداری بالا، دارا بودن شکاف انرژی (3.37 eV)، انرژی پیوند اکسایتون بزرگ (meV) و داشتن دمای کوری بالا، یک کاندیدای خوب برای ابزارهای اپتوالکترونیک مثل فتودتکتورها، دیودهای لیزر فرابنفش و دیودهای ساطع کننده نور مرئی است [۳–۶].

خواص اکسید روی به ساختار آن وابسته است به طوری که گاف انرژی آن را میتوان با آلاییدن مهندسی نمود. آلایندهها

فصلنامه سراميك

וזלוט

2010

۷۱ شماره

ש היעו

°°y



میتوانند خواص اپتیکی و مگنتواپتیکی را به شدت تغییر دهند. اکسید روی آلایش شده میتواند در دمای اتاق رفتار فرومغناطیس از خود نشان دهد که ناشی از حاملهای بار آزاد حاصل شده از مقدار معینی فلز انتقالی است [Y]. فلزات انتقالی همچون Mr، F، IR و OD آلایندههایی هستند که بیش ترین علاقه را برای آلاییده شدن کسب کردهاند. چرا که این مواد زمانی که به ماده ID و OD آلایندههایی هستند که بیش ترین علاقه را برای آلاییده شدن کسب کردهاند. چرا که این مواد زمانی که به ماده ID وضافه میشوند علاوه بر ایجاد رفتار فرومغناطیس در ماده، خواص نیمهرسانا آن را نیز حفظ میکنند. یون کبالت به دلیل دارابودن شعاع یونی (Å 8.50) نزدیک به روی (Å 0.60) و همچنین ممان مغناطیسی قوی در مقایسه با دیگر فلزات انتقالی معمولاً معنوان یکی از گزینههای اصلی در مواد گالایند میشود [Y]. زمانی که کبالت به دلیل دارابودن معولاً به عنوان یکی از گزینههای اصلی در مواد گال انتخاب میشود [Y]. زمانی که کبالت به دلیل دارابودن این معمولاً معنوان یکی از گزینههای اصلی در مواد گالایند میشود [Y]. زمانی که کبالت به دلیل دارابودن شعاع یونی (Å 5.80) نزدیک به روی (Å 0.60) و همچنین ممان مغناطیسی قوی در مقایسه با دیگر فلزات انتقالی معمولاً معنوان یکی از گزینههای اصلی در مواد گالال انتخاب میشود [Y]. زمانی که کبالت به داخل اکسید روی آلایش میشود. این نظریههای معلی در مواد گال انتخاب میشود [Y]. زمانی که کبالت به داخل اکسید روی آلایش میشود. این نظریههای معنوان یکی از گزینههای اصلی در مواد گالیس باشد. اما هنوز سازوکار این رفتار به طور کامل درک نشده است و (سی میتوان ید میتوان یک می وارد اشاره کرد: (۱) مدل زنر (۲) سازوکار برهم کنش دوگانه (برهمکنش مستقیم) یا سازوکار ابر برهمکنش (برهمکنش غیرمستقیم از طریق عیوب) بین کاتیونهای مغناطیسی و (۳) حامل (الکترون آزاد) واسطهای در بر همکنشهای نوع رودرمن کیتل خاسویا میوال یوسیدا (بر ایز رفتال میار و (۳) حامل (الکترون آزاد) واسطهای در بر همکنشهای نوع رودرمن کیتل کاسیویا یوسیدا (۲۸) (الاکترون آزاد) واسطهای در بر همکنشهای نوع رودرمن کیتل کاسیویا یوسیدا یوسیدا (۲) هرو و (۳) حامل (الکترون آزاد) واسطهای در بر همکنشهای نوع رودرمن کیتل کاسیویا یوسیدا کرد.

مطالعات متعددی از اثر آلایش همزمان بر روی ZnO توسط دو کاتیون انجام شده است در این مطالعات هدف یافتن ترکیباتی است که علاوه بر رفتار فرومغناطیس دمای کوری را نیز به دلیل افزایش حاملهای بار افزایش دهند. پاسکاریو و همکارانش نیکل و کبالت را به طور همزمان در اکسید روی آلایش نمودند و مشاهده کردند که خواص فتوولتائیک ماده میتواند به ازای ۲ درصد برای هر دو آلاینده بهبود یابد [۱۰] . از دیدگاه خواص مغناطیسی نیز آلایندههای دوتایی از جمله ای Co-Cr ، Ni-Cu - O-Cr ، Ni-Cu ، در آلاینده میبود یابد ای از دیدگاه خواص مغناطیسی نیز آلایندههای دوتایی از جمله ای Co-Cr ، Ni-Cu - O-Cr و بسیاری موارد دیگر بررسی شدند. در این حالتها، مشاهده شد که خواص مغناطیسی در مقایسه با حالت تک آلاینده سریعتر افزایش می یابد. دلیل این موضوع را میتوان به دلیل افزایش غلظت حامل ها در اکسید روی می شود که باعث افزایش عیوب و در نتیجه القای خاصیت فرومغناطیس با قدرت بیشتر می شود [۱۲, ۱۲].

در این پژوهش عنصر کبالت به عنوان آلاینده اصلی انتخاب شد و در کنار آن یک آلاینده برای بررسی اثر هم آلایندگی انتخاب گردید. همچنین با توجه به این که در غلظتهای بالای آلاینده خصوصا آلایندههای با شعاع یونی بزرگتر نسبت به یون روی امکان تشکیل کلاسترهای فلزی وجود دارد، که خود میتواند منجر به کاهش دانسیته بار شود، از غلظت پایین آلاینده استفاده شد [۱۲]. فرمول کلی مورد بررسی در این پژوهش به صورت (M: Cu, Ca, Mg) O(M: Cu, Ca, Mg میباشد که مقدار آلاینده کبالت ۲ درصد و M نیز ۲ درصد در نظر گرفته شده است. روش سنتز نیز روش سل- ژل میباشد و پس از سنتز نانوذرات به بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی مواد پرداخته میشود .

## ۲- مواد و روش تحقیق

#### ۲-1- مواد اوليه

همه مواد اولیه مورد استفاده در پژوهش از درجه کیفی آنالیتیکال بوده و بدون هر نوع فرآوری مورد استفاده قرار گرفتهاند. اتانول (C2H5OH)، استات کبالت ۷۹٪ (Co(CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>)2)، نیترات منیزیم ۹۸٪ (Mg(NO<sub>3</sub>)2.6H<sub>2</sub>O)، نیترات کلسیم (Ca(NO<sub>3</sub>)2.4H<sub>2</sub>O)، از شرکت مرک آلمان و اگزالیکاسید ۹۹/۵٪ (HO<sub>2</sub>CCO<sub>2</sub>H)، استاتروی ۹۹٪ (Zn(CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>)2) و نیترات مس ۹۹/۵٪ (Cu(NO<sub>3</sub>)2.3H2O) از شرکت سامچون (Samchun Pure Chemicals Company, Korea) تهیه شدند.

### ۲-۲-روش ساخت نانوذرات

برای ساخت نانوذرات از روش سل- ژل استفاده شد. در این روش برای ساخت اکسید روی خالص ابتدا محلول ۲۸۰ مولار استات روی با نسبت حلال ۲۵:۲۵ از آب دیونیزه و اتانول ساخته شد، و برای آلاینده کبالت مقدار ۲ درصد استات کبالت به عنوان آلاینده پایه و در سایر ترکیبات هر بار مقدار ۲ درصد از سایر ترکیبات (منیزیم، کلسیم و مس) به عنوان آلاینده دوم در محلول جایگزین استات روی گردید. سپس محلول ۲/۵ مولار از اگزالیک اسید با نسبت حلال ۲۵:۲۵ از آب دیونیزه و اتانول ساخته شد و به مدت ۳ دقیقه درحمام سونیکیت حل گردید. در ادامه محلول شامل استات روی به مدت ۳۰ دقیقه تحت شرایط رفلاکس قرار می گیرد و محلول ۲/۵ مولار اگزالیک اسید بااستفاده از قیف دکانتور به صورت قطرهای وبه تدریج به محلول زینک استات حاوی مقالات يژوهشر

یونهای فلزی که به طور مداوم در حال هم زده شدن بود اضافه می گردد تا ژل مطلوب تهیه شود. هنگامی که ژل به طور کامل تشکیل شد، مخلوط به طور مداوم به مدت۶۶ دقیقه همزده شد. ژل تولید شده در دمای ۸۰ درجه به مدت ۲ ساعت خشک و پودر به دست آمده به مدت۲ ساعت دردمای ۴۰۰ درجه کلسینه می گردد [۱۳].

#### ۲-۳- مشخصهیابی و اندازهگیری

به منظور مطالعه ساختاری از آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) توسط دستگاه پراش اشعه ایکس مدل Philips- PW1730 با طول موج ۱/۵۴۰۶۰ آنگستروم و زاویه پراش بین ۸۰– ۲۰ درجه و آند مس در دمای اتاق استفاده شد. به منظور بررسی خواص ساختاری و نوار های جذبی، آنالیز طیفسنجی تبدیل فوریه (Perkin Elmer FTIR, 1403 spectrophotometer) در محدوده ساختاری و نوار های جذبی، آنالیز طیفسنجی تبدیل فوریه (RAT) میدانی میدانی المان المان المان المان المان المان الم مواد ۱۰۰۰ انجام شد. شکل و توزیع اندازه نانوذرات اکسید روی سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (MIRA3TESCAN-XMU) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی خواص مغناطیسی نانو پودرها، از دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) مدل MDKF) مان المان المان المان در دمای اتاق استفاده شد. برای اندازه گیری شکاف باند نمونه از آنالیز طیف بازتاب– پخشی (DRS) توسط دستگاه Elmer L20 استفاده شد.

#### ۳- نتایج و بحث

#### ۳-۱-آنالیز پراش اشعه ایکس

به منظور بررسی تاثیر آلایش کردن بر ترکیب و ساختار بلوری طیفسنجی اشعه بر روی نمونههای (M: Cu, Ca, Mg) (M: Cu, Ca, Mg) (M: Cu, Ca, Mg) مربوط به ساختار ورتزیت را در نمونهها میتوان مشاهده کرد (ICPD card no. 036–1451) [۹۲]. بر این اساس تقارن سلول واحد نمونهها توسط گروه فضایی p63mc یا V<sup>6</sup>V قابل کرد (ICPD card no. 036–1451) [۹۲]. بر این اساس تقارن سلول واحد نمونهها توسط گروه فضایی p63mc یا C<sup>4</sup>V قابل توصیف است که در آن صفحات متناوب چهاروجهیهای متشکل از یونهای <sup>-2</sup>O و <sup>+2</sup>N در امتداد محور c فشرده شدهاند. در اینجا تمامی الگوها ساختار تک فاز را نشان میدهند و هیچ قله اضافی و ناخالصی مشاهده نشده است و نشاندهنده آلایش موفقیت آمیز یونهای الگوها ساختار تک فاز را نشان میدهند و هیچ قله اضافی و ناخالصی مشاهده نشده است و نشاندهنده آلایش موفقیت آمیز یونهای فلزی (Cu, Ca, Mg) به صورت همزمان با عنصر کبالت در شبکه اکسید روی میباشد. برای بررسی پارامتر شبکه از روش ریتولد استفاده شد همچنین اندازه متوسط بلورکها از پیکهای XRD با استفاده از نرمافزار High Score plus با محکل با در شبکه ای XRD با استفاده از نرمافزار دان و دان و دان و مولو با مرسی و ساختار با منوب میبکه از روش ریون می میباشد. در میبان در شبکه از روش ریتولد استفاده شد همچنین اندازه متوسط بلورکها از پیکهای XRD با استفاده از نرمافزار XRD و فرمول شرر بدست آمد (جدول ۱).



۵1

مقالات يژوهشى

[ DOR: 20.1001.1.17353351.1400.17.0.10.9 ]

اندازه بلورک(Å)	پارامتر شبکه(Å)		ساختار کریستالی	فرمول شيميايي	نمونه
	с	a=b			
188	۵/۲۰۰	٣/٢٢٠	ورتزيت هگزاگونال	Zn0.98Co0.02O	ZnCo
٩٧	۵/۲۰۰	٣/٢٢٠	ورتزيت هگزاگونال	Zn0.96Co0.02Ca0.02O	ZnCoCa
18.	۵/۱۷۷	37/236	ورتزيت هگزاگونال	Zn0.96Co0.02Mg0.02O	ZnCoMg
١٢٢	۵/۲۰۷	۳/۲۵۳	ورتزيت هگزاگونال	Zn <sub>0.96</sub> Co <sub>0.02</sub> Cu <sub>0.02</sub> O	ZnCoCu

جدول ۱- نتایج حاصل از آنالیز پراش اشعه ایکس به روش شرر

#### **DRS -۲-۳** آنالیز

مقالات پژوهشر

برای مطالعات شکاف باند، تکنیک طیفسنجی بازتاب– پخشی (DRS) مورد استفاده قرار گرفت. از طیف DRS شکاف باند اکسید روی آلاییده شده و خالص با استفاده از رابطه (Ahv – Eg =<sup>۲</sup>( αhv) که توسط تاک، دیویس و مات ارائه شده، محاسبه شد. که ۵۸ ۷، ۸ و Eg به ترتیب ضریب جذب، فرکانس نور، ثابت تناسب و شکاف باند هستند [۶۶]. همان طور که در شکل نشان داده شده است از نمودار <sup>۲/</sup>( αhv) بر حسب hv میتوان شکاف باند را با برونیابی خط مستقیم قطع کننده محور، ارزیابی کرد. با استفاده از تکنیک DRS و به دنبال آن رابطه عددی داده شده در بالا شکاف باند همه نمونهها محاسبه شد. برای نمونه خالص اکسید روی شکاف باند با مقدار عددی ۳/۰ الکترون ولت میباشد که با مقادیر ارائه شده در مقالات مطابقت دارد. آنگولا ودیجن برای نمونههای اکسید روی خالص مقادیر شکاف باند را از ۳/۱۳ تا ۳/۳۱ الکترون ولت محاسبه کردند [۷].

برای نمونههای آلایش شده کاهش مقدار شکاف باند مشاهده شده است که این نتایج نیز با نتایج گزارش شده در منابع و مقالات همخوانی دارد. برای مثال هوآنگ و همکاران اختلاف سطح انرژی بین پایین باند هدایت و جای خالی اکسیژن منفرد برای نمونه اکسیدروی آلایش شده با کبالت را ۲/۳ الکترون ولت محاسبه کردند[8]. انرژی شکاف باند هر۵ نمونه طبق روابط گفته شده و شکل ۲ برای نمونههای ZnCoCa، ZnCOMg، ZnCO و ZnCoca به ترتیب ۲/۵، ۲/۴، ۲/۴ و/۲ الکترونولت محاسبه شده شکل ۲ برای نمونههای Znco ، مقدار شکاف باند به چند فاکتور از جمله پارامترهای شبکه، اندازه دانه، غلظت عیوب و حاملها و است. این تغییر قابل ملاحظه در مقدار شکاف باند به چند فاکتور از جمله پارامترهای شبکه، اندازه دانه، غلظت عیوب و حاملها و غیره بستگی دارد. به طور کلی، حاملهای اضافی که از طریق آلاییده شدن (در نمونههای شامل یونهای Cn M، ۵، Pa، مونهای شامل یونهای Cn م Ca وارد زمینه ZnO می شوند، مسئول تغییر در انتقال باند به باند نوری برای نمونههای آلایش شده می باشند. این به عنوان اثر بورستین – ماس (Bustein-Moss) شناخته می شود که مقادیر زیادی از چگالی حاملهای موضعی برای تغییر در پیکهای جذب ضروری است. کاهش سیستماتیک در شکاف باند می تواند ناشی از تغییرات ساختاری با افزودن یونهای فلزی به ZnO باشد. کبالت و روی در جدول تناوبی در نزدیکی یکدیگر قرار دارند و دارای الکترونگاتیوی یکسان هستند و زمانی که جایگزین یکدیگر می شوند، همان طور که از مطالعات XR ما نیز مشهود است تغییر مهمی در ساختار کریستالی ایجاد نمی کنند اما تغییر قابل می شوند، همان طور که از مطالعات CR ما تیز مشهود است تغییر مهمی در ساختار کریستالی ایجاد نمی کنند اما تغییر قابل

باریک شدن مشابه شکاف باند در منابع مشاهده شده است و توسط تعامل تبادل اسپین b-d بین الکترونهای باندی و الکترون های موضعی یون فلز انتقالی جایگزین یون <sup>+</sup>Co<sup>2</sup> توضیح داده شده است. کاهش شکاف باند توسط آلایش کبالت، همچنین ناشی از اختلاط قوی b-d ، O و Co میباشد. انتقال قرمز در شکاف باند به لحاظ تئوری توسط بیلسما (ByIsma) و همکاران با استفاده از تعملات تبادل b-s و b-d و با به کار گرفتن تئوری آشفتگی مرحله دوم توضیح داده شده است. این نشان میدهد که انتقال قرمز رنگ شکاف باند، جایگزینی یکنواخت یونهای کبالت را در شبکه ZnO تایید میکند. علاوه بر این باریک شدن شکاف باند ناشی از اثرات ساختاری زیادی روی نوارهای هدایت و ظرفیت میتواند شکاف باند ناشی از تعامل الکترون و مرکاف باند ناشی از اثرات ساختاری زیادی روی نوارهای هدایت و ظرفیت میتواند شکاف باند ناشی از تعامل الکترون و پراکندگی ناخالصی را کاهش دهد. این امر به ادغام باند ناخالصی به باند هدایت نسبت داده شده است و شکاف باند را کاهش

Downloaded from jicers.ir on 2025-05-17



شکل۲. نمودارهای DRS مربوط به نمونههای اکسید روی خالص و اکسیدروی آلایش شده با یونهای مختلف

#### Far-FTIR آناليز

طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، اطلاعات مربوط به گروههای عاملی موجود در نمونه، هندسه مولکولی، تعاملات داخلی یا درون مولکولی را ارائه میدهد. در این مطالعه آنالیز Far-FTIR برای مطالعه و بررسی حالت ارتعاشی نمونههای آلاییده شده استفاده شده است. طیف Far-FTIR نمونهها در شکل ۳ نشان داده شده است. عموما پیوند بین عناصر غیر آلی در فرکانس های زیر ۲۰۰۳ ۲۰۰ میباشد. باندهای برجسته مشاهده شده در حدود ۲۰۰۳ ۲۰۰ و ۲۰۰۰ ۲۰۱ برای نمونههای آلاییده شده ناشی از ارتعاش کششی پیوند O-n در نظم تتراهدرال میباشد. باندهای موجود در حدود ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ برای نمونههای آلاییده شده ناشی از ارتعاش کششی پیوندهای O-n در نظم تتراهدرال میباشد. باندهای موجود در حدود ۲۰۰۰ میباندهای خیلی ضعیف و مختص ارتعاش کششی پیوندهای O-n در نظم اکتاهدرال هستند. نظم تتراهدرال بسیار متداول تر و قوی تر از نظمهای اکتاهدرال در امونههای تهیه شده هستند. بنابراین، این امر مجددا ساختار ورتزیت نمونهها را تایید میکند [۴]. وجود باند ضعیف در حدود ۲۰۰۰ ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ میاند میدهد که آلایش یونهای واسطه هیچ اثری بر باند مربوط به نظم اوکتاهدرال ندارد. بنابراین یونهای واسطه فقط در نظم تتراهدرال به جای نظم اوکتاهدرال در Cn جایگزین میشوند. فرکانسهای باند در حدود ۲۰۰۰ در ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میاند در ایند آند آن میا و حافی از اسیدیته لوییس هستند، درحالیکه باند در حدود ۲۰۰۰ میا تا در در ۲۰۰۰ تا ۲۰۰ در آنه میده که آلایش یونهای واسطه هیچ اثری بر باند مربوط به نظم اوکتاهدرال ندارد. بنابراین یونهای در اسطه فقط در نظم تتراهدرال به جای نظم اوکتاهدرال در Cn جایگزین میشوند. فرکانسهای باند در حدود ۲۰۰۰ در ۲۰۰ ۲۰۰ مختص ارتعاشات کششی نامتقارن گروه C=۵ ناشی از اسیدیته لوییس هستند، درحالیکه باند در حدود ۲۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰

[ DOR: 20.1001.1.17353351.1400.17.0.10.9 ]

[Downloaded from jicers.ir on 2025-05-17]

مقارات يژوهشى

57





شكل ٣. نمودار Far-FTIR نمونه هاىZnCoCaO ،ZnCoMgO ،ZnCoO ،ZnO

#### ۳-۴- مطالعه و بررسی خواص مغناطیسی

طبق مطالعات انجام شده، نانوذرات نسبت به سایر نانوساختارها مثل نانو میلهها و میکرودیسکها و غیره، مغناطش اندکی بالاتر دارند. فرض شده است که ظهور عیوب شبکه کنترل نشده میتواند حاملهایی برای رفتار فرو مغناطیسی تولید کند. اخیرا پنی گری (Panigrahy) و همکاران ارتباط و همبستگی روشنی را بین بروز عیوب و مغناطش نانو میلههای اکسید روی گزارش دادند [۱۷]. براساس مطالعات انجام شده، این احتمال وجود دارد که جاهای خالی اکسیژن در شبکه نانوساختارهای اکسید روی، ممان های اسپین مغناطیسی خنثی نشده که مسئول رفتار فرومغناطیسی مانند، هستند را ایجاد میکنند. مغناطیس اندکی بالاتر مشاهده شده در نانوذرات اکسید روی ممکن است ناشی از درصد بالاتر غلطت عیوب اکسیژن و یا خطای دستگاهی باشد [۸]. منحنیهای مغناطیسی وابسته به میدان برای همه نمونهها در شکل ۴ نشان داده شده است.

در نمونه ZnCo منحنی H-H درشکل ۴ نشان دهنده رفتار فرومغناطیس با حلقه هیسترزیس نزدیک میدان میباشد. مرکز حلقه هیسترزیس به سمت پایین در امتداد محور مغناطش و به سمت راست در امتداد میدان مغناطیسی منتقل شده است. این بدان معنی است که نمونه رفتار چرخش وارونه همراه با تعامل بایاس (مورب) تبادل از خود نشان میدهد. دلایل متعددی برای مشاهده فرومغناطیس در نانوذارت اکسید روی آلایش شده با کبالت وجود دارد. بعضی از آنها عبارتند از: تشکیل فاز ثانویه از خوشههای فلز OS در شبکه OnD افزایش دانسیته حامل بار آزاد ناشی از آلایش یونهای <sup>+2</sup>OC در OD و ایجاد جاهای خالی اکسیژن و عیوب ناشی از ناخالصی مثل عنصر آلاییده شده در زمینه اکسید روی. اما در نمونه OD در موای میونه تشکیل فاز ثانویه با توجه به نتایج ARD و XRD افزایش دانسیته حامل بار آزاد ناشی از آلایش یونهای <sup>+2</sup>OS در OD و ایجاد جاهای خالی اکسیژن و موب ناشی از ناخالصی مثل عنصر آلاییده شده در زمینه اکسید روی. اما در نمونه OD میه هیچ گونه تشکیل فاز ثانویه با توجه به نتایج ARD و XRD افزایش دانسیته حامل بار آزاد ناشی از آلایش یونهای <sup>+2</sup>OS در OD و ایجاد جاهای خالی اکسیژن و را نشان میدهند. اما با عدم وجود فاز ثانویه از خوشه فلزی OC، نمونه OD میه میچ گونه تشکیل فاز ثانویه با توجه را نشان میدهند. اما با عدم وجود فاز ثانویه از خوشه فلزی OD منهونه OD میا شدی از میونه ما می میه می می می می می می را نشان میدهد. منشا می باشد [۸ ۸۸].

یکی دیگر از دلایل ظهور فرومغناطیس در نانو ذرات ZnO آلاییده شده با Co، وجود عیوبی مانند جای خالی یا بیننشینی Zn و

مقالات پژوهشر

Downloaded from jicers.ir on 2025-05-17

O میباشد. تعامل تبادلی بین عنصر الاییده شده CO و عنصر میزبان Zn یا O نیز مسئول رفتار فرو مغناطیس دمای اتاق در نانو ساختارهای ZnO آلاییده شده با CO میباشد. همان طور که غلظت CO در ZnO افزایش مییابد، تعامل قوی تری بین یونهای +CO<sup>2</sup> و +Zn<sup>2</sup> اتفاق میافتد. بنابراین، مغناطش اشباع با افزایش غلظت CO در شبکه ZnO افزایش مییابد. میتوان نتیجه گرفت که ZnO خالص ماهیت دیامغناطیسی نشان میدهد در حالی که نمونه ZnCo رفتار فرو مغناطیسی نشان میدهد که ناشی از عیوب مربوط به اکسیژن و روی میباشد. رفتار فرو مغناطیس دمای اتاق مشاهده شده برای نمونههای تهیه شده میتواند برای کاربردهای اسپینترونیک مورد استفاده قرار گیرد [۸, ۱۵, ۱۸].

همچنین در منحنی H-H نمونه ZnCoCu دیده میشود که نمونه ZnO آلاییده شده با (Cu،Co) رفتار فرومغناطیسی ضعیفی را نشان میدهد. در حالی که نمونه ZnCo رفتار هیسترزیس مغناطیسی با مغناطش اشباع نزدیک به ZnCo ۲۰۰۲ را نشان میدهد. همچنین مشخص شده است که نمونه ZnCoCu یک روند غیر اشباع را با تقریبا یک افزایش خطی در مغناطش با میدان مغناطیسی نشان میدهد و مقدار ممانهای مغناطیسی کمتر از نمونه ZnCo میباشد. لین و همکارانش [۱۹] نشان دادند که مقدار مغناطش نمونه همآلایش مس-کبالت به مقدار ماده آلاییده شونده بستگی دارد به طوری که با افزایش ۱ درصد مس به ترکیب خواص مغناطیسی افزایش و بعد از آن کاهش مییابد. البته در اینجا با توجه به تفاوت در روش ساخت تفاوت محسوسی مشاهده نشد. همانطور که در شکل ۴ مشاهده میشود اما برای سایر نمونهها رفتار کاهشی مشاهده شده است. این اتفاق میتواند به دلیل عدم انتخاب صحیح مقدار هم آلاینده باشد و همانطور که در تحقیق انجام شده توسط لین [۱۹] هم دیده شد، فقط مقادیر بحرانی آلاینده میتواند سبب تغییر در خواص مغناطیسی شود. البته شایان ذکر است که همآلاینده سبب تغییر در گاف



20

مقالات يژوهشر

فصلنامه سراميك أيران دوره ١٧ شماره ٤ ياييز ٥٠٦٠

#### ۴- نتیجهگیری

مقالات يژوهشر

در این تحقیق به سنتز نانوذرات اکسید روی با استفاده از روش سل – ژل پرداخته شد. سپس جهت بررسی تاثیر آلاینده، کبالت و برای بررسی همآلاینده به ترکیب آن آلایندههای مس، منیزیم و کلسیم اضافه گردید. در آنالیز پراش اشعه ایکس با توجه به مقدار کم آلاینده فاز ناخالصی در نمونه ها مشاهده نشد. البته آنالیز طیفسنجی فروسرخ نیز این موضوع را تایید نمود. در همه نمونهها پیک مشخصه مربوط به ارتعاش O-M-Zn در محدوده ۲۰۰۰ cm<sup>1</sup> مشاهده گردید. مشاهده شد که انرژی شکاف باند برای تمامی نانوذرات اکسید روی سنتز شده در نتیجه آلایش این عناصر کاهش می ابد. البته این کاهش در نتیجه آلایش با مس بیشتر است که ممکن است به کمتر بودن گاف انرژی در اکسید مس و نقش یون مس در ساختار آن را ارتباط داد. لذا نمونه هم آلاییده شده با مس و کبالت ضمن حفظ خواص مغناطیسی ماده سبب کاهش گاف انرژی می شود. لذا از این رو می تواند به عنوان یک نیمه رسانا مغناطیسی رقیق مطرح گردد.

# مراجع

- [1]L. Mustafa, S. Anjum, S. Waseem, S. Javed, S. M. Ramay, and S. Atiq, Materials Research Bulletin 84, 32 (2016).
- [2] B. Yahmadi, O. Kamoun, B. Alhalaili, S. Alleg, R. Vidu, and N. K. Turki, Nanomaterials 10, 1 (2020).
- [3]D. E. Aimouch, S. Meskine, A. Boukortt, and A. Zaoui, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 451, 70 (2018).
- [4] R. Kumari, A. Sahai, and N. Goswami, Progress in Natural Science: Materials International 25, 300 (2015).
- [5] A. Chanda, S. Gupta, M. Vasundhara, S. R. Joshi, G. R. Mutta, and J. Singh, RSC Advances 7, 50527 (2017).
- [6] I. P. Duru, E. Ozugurlu, and L. Arda, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 504, 166653 (2020).
- [7]S. Fabbiyola, L. J. Kennedy, U. Aruldoss, M. Bououdina, A. A. Dakhel, and J. JudithVijaya, Powder Technology 286, 757 (2015).
- [8] B. Salameh, A. M. Alsmadi, and M. Shatnawi, Journal of Alloys and Compounds 835, 155287 (2020).
- [9] N. Tiwari, A. Lohar, C. Kamal, A. Chakrabarti, C. L. Prajapat, P. K. Mishra, P. Mondal, B. Karnar, N. L. Misra, S. N. Jha, and D. Bhattacharyya, Journal of Physics and Chemistry of Solids 104, 198 (2017).
- [10] P. Pascariu, I. V. Tudose, M. Suchea, E. Koudoumas, N. Fifere, and A. Airinei, Applied Surface Science 448, 481 (2018).
- [11] N. Bhakta and P. K. Chakrabarti, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 485, 419 (2019).
- [12] M. Ashokkumar and S. Muthukumaran, Optical Materials 37, 671 (2014).
- [13] P. Periyat and S. G. Ullattil, Materials Science in Semiconductor Processing 31, 139 (2015).
- [14] K. A. Alim, V. A. Fonoberov, M. Shamsa, and A. A. Balandin, Journal of Applied Physics 97, 124313 (2005).
- [15] G. P. Singh, A. K. Aman, R. K. Singh, and M. K. Roy, Optik 203, 163966 (2020).
- [16] M. Sajjad, I. Ullah, M. I. Khan, J. Khan, M. Y. Khan, and M. T. Qureshi, Results in Physics 9, 1301 (2018).
- [17] L. Huang, Y. Hao, and M. Hu, Materials Science in Semiconductor Processing 74, 303 (2018).
- [18] J. C. Fan, K. M. Sreekanth, Z. Xie, S. L. Chang, and K. v. Rao, Progress in Materials Science 58, 874 (2013).
  [19] H.-T. Lin, T.-S. Chin, J.-C. Shih, S.-H. Lin, T.-M. Hong, R.-T. Huang, F.-R. Chen, and J.-J. Kai, Applied Physics Letters 85, 621 (2004).

09

# Synthesis and Investigation of Optical and Magnetic **Properties of Co-Doped Zinc Oxide Nanoparticles**

Shekofeh Ahmadpour, Ibrahim Sharifi\*, MohammadReza Nilforoushan

Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

\* ibrahim.sharifi@outlook.com

Abstract: In this study, the effect of simultaneous doping of magnesium, calcium, and copper ions on the properties of zinc oxide doped with cobalt was investigated. The sol-gel method has been used for the synthesis of nanoparticles. The structural and optical properties of the synthesized nanoparticles were investigated using X-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy (FTIR), and DRS spectroscopy. Rietveld's analysis of XRD patterns confirmed the hexagonal wurtzite phase structure. In infrared spectroscopy, bands related to this structure were detected at a wavenumber of about 400 cm-1. Microscopic images showed that fine zinc oxide particles with dimensions of 10 to 20 nm were agglomerated by sticking to each other. In addition, it was found that the bandgap of the doped samples was reduced relative to pure zinc oxide. Due to the addition of cobalt as a dopant, the bandgap energy reduced from 3.0 eV to 2.5 eV. Also, copper ion as a second dopant in the composition caused a further reduction in the bandgap and reaches about 2.1 eV. The examination of the samples by the VSM device showed that the magnetic properties of the particles are enhanced by the addition of cobalt dopant and reach 40 memu / g. However, as a result, the magnetic property is reduced with other co-doped samples. copper and cobalt co-doped zinc oxide have no significant changes in magnetic properties. Therefore, with a lower bandgap and the best magnetic properties, this sample can be considered the most suitable sample in the dilute magnetic semiconductors' application.

Keywords: Nanoparticles, zinc oxide, sol-gel, diluted magnetic semiconductor.

فصلنامه سرامیک ایران دوره ۱۷ شماره ۳ پاییز ۲۰۰۰